



کاواک نانوباریکه بلورفوتونی فابری- پرو با نانوباریکه سهموی و سری حفرههای-هوای باریکشده

عاطفه محسنىفرد و احمدرضا دارائي

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده – در این مقاله، طولموج، فاکتور کیفیت و توزیع مد محبوس در کاواک نانوباریکه بلورفوتونی متشکل از چهار حفره-هوای باریکشده در طرفین کاواک سهموی، و آرایه نه تایی حفره-هوا آینه ها ، مورد بررسی قرار گرفته است. طولموج مد مورد بررسی جهت تولید و تقویت در نانوکاواک با تغییر پارامترهای هندسی مختلف ساختار کاواک نانوباریکه بلور فوتونی انتخاب شد. تغییرات ثابت شبکه و تعداد حفرههای آینهای در نانوباریکه، تقویت فاکتورکیفیت مد را در پی دارد. وجود حفره های باریک شده، مد با کیفیت حدود ۲۰۰۰ را ایجاد نمود که به ازای کاهش ۲۵ نانومتری مکان ۴ حفره باریک شده طرفین نانوکاواک میسر گردیده است. نتایج نشان دادند که باریک شدگی سهموی کاواک، در افزایش فاکتور کیفیت از طریق تمرکز بیشتر شدت مد در میانه و در نتیجه در کاهش حجم مدی و پراکندگی، مؤثر واقع میگردد.

كليدواژه- بلور فوتونى، فاكتور كيفيت، نانوباريكه، سرى حفره-هواى باريك شده، كامسول مولتى فيزيك.

Fabry-Pérot Based Photonic Crystal Nanobeam Cavity, With Parabolic-Nanobeam Accompanied by Taper Air-Holes

Atefeh Mohsenifard and Ahmadreza Daraei

Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan

Abstract- In this paper, wavelength, quality factor (Q) and confined mode distribution in the photonic crystal nanobeam cavity containing tapers with 4 air-holes nearby parabolic form narrowed nanocavity with couple of 9 air-holes mirrors are investigated. A high-Q mode was chosen to be created and enhanced by changing structural parameters of the nanobeam cavity. Variation of lattice constant and tapers, and number of air-holes in the mirrors offer improvements in the quality factors. The Q-values as high as 10410 are obtained by hiring couple of the tapers which their 4 air-holes centers have 25 nm reductions in positions. The results showed that the increasing in the Q-values occur as a consequence of more concentration of mode in the combined parabolic shape nanocavity and air-hole centers displaced tapers, and therefore reduction in diffraction and modal volumes.

Keywords: Photonic Crystal, Fabry- Pérot, Quality Factor, Parabolic Nanobeam, Taper Air-Holes, COMSOL Multiphysics.

۱–مقدمه

نانوکاواکهای بلور فوتونی ایجاد شده در محیطی شامل دیالکتریک- نیمرسانا، نور را در حجم کوچکی در مقیاس کسری از مکعب طول موج نور در محیط، محبوس می کنند[۱]. فاکتور کیفیت بسیار بزرگ مدها و حجم مدی کوچک در این نانوساختارها، کاربردهای جدید و گستردهای را در حیط ههای مختلف مانند لیزرهای با آستانه پایین، اپتیک غیر خطی، تحقق آزمایشات الکترودینامیک کوانتومی کاواک در محیط مواد حالت جامد و فیبر مخابرات نوری دارند[۴–۲].

ساختار نانوباریکه بلور فوتونی، همانطوری که در طرحواره شکل ۱ نشان داده شده، دارای آرایه تناوبی از حفرههای-هوا (air-holes) در یک تیغه موجبر نیمرسانای طویل با سطح مقطع مستطیلی به پهنای w و ارتفاع h کمتر از نیم طول موج، است.



شکل ۱: طرحواره یک نانوباریکه بلور فوتونی، که دارای آرایه تناوبی از حفرههای-هوا در یک تیغه موجبر نیمرسانای طویل با سطح مقطع مستطیلی به پهنای w و ارتفاع h کمتر از نیمطولموج، است.

یک نانوکاواک را می توان با برهمزدن نظم در آرایش تناوبی حفرههای – هوا و ایجاد نقص، در مرکز موجبر بلور فوتونی ایجاد نمود[۵-۲]. این نقص، می تواند به طور ساده به صورت جابجا شدگی چند حفره هوا در جهت دور شدن از مرکز کاواک باشند، و یا مثلاً مطابق شکل ۱، از حذف یک حفره – هوا از اچینگ شدن (علامت گذاری شده با ضربدر) بدست آید که فضای ایجاد شده، نانوکاواک را تشکیل می دهد. اندازه موجبر و ابعاد شبکه بلور فوتونی طوری طراحی شدهاند که مد منتشر شده در موجبر در ناحیه گاف نواری انرژی بلور فوتونی متشکله قرار گیرد.

امتداد محور موجبر، توسط آرایش دورهای حفرههای هوا (بازتاب براگ) که منشاء گاف نواری فوتونیکی ساختار است، و در جهت عمود بر موجبر توسط اختلاف ضریب

شکست در سطح مشتر ک هوا-نیمرسانا-هوا در طرفین و بالا و پایین (بازتاب داخلی کلی)[۹-۶, ۹]. از پارامترهای مهم در این نوع ساختارها، فاکتور کیفیت (Q) مدها است؛ که کمیتی بدون بعد بوده و چگونگی محدود شدن فوتونها درون کاواک را به خوبی توصیف نموده و برای محاسبه آن، از رابطه (۱) استفاده میشود: (۱) که $0 = 0_0 / \Delta \omega$ که 0_0 فرکانس تشدید مد و $\Delta \omega$ پهنا قله مد در نصف ارتفاع ماکزیمم است [۷-۵].

۲-نانوباریکه بلورفوتونی با حفرههای باریکشده

ساختار نانوباریکه بلورفوتونی در این مقاله، شامل یک ردیف از حفرههای-هوا است که در طول یک موجبر فوتونی به پهنای ۵۰۰ nm ایجاد شده و دارای ضریب شکست مؤثر ۳/۱۹ میباشد.

در این مقاله، قطبش TE مورد مطالعه بوده است. مقادیر فاكتور كيفيت زياد بدست آمده، وابسته به انتخاب صحيح پارامتر حفرهها، که شامل قطر حفرهها، فاصله دورهای حفرههای آینهای، اندازه مختلف ثابت شبکه و قطر حفرهها در بخش باریک شده و طول کاواک است. تعداد حفرههای دورهای باریکشده در اطراف کاواک (N_{TI}) به ۴ عدد بهینهسازی شده است. ساختار در نظر گرفته شده، شامل یک تک حفرہ باریک شدہ در ناحیہ دور از کاواک (N_{TO}=۱) در طرفین و آینه ها شامل ۴ حفره دورهای با قطر (d)، nm و ثابت شبکه (a)، ۳۵۰ می باشد. مقدار فاکتور کیفیت ۳۴۴۰ محاسبه گردیده و طولموج مد تشدید ۱۵۸۳/۹ nm و پهنا در نصف ارتفاع ماکزیمم قله مد (FWHM) ، برای کاواکی به طول nm بدست آمده است. برای کاواکهایی به طول ۳۹۰nm ۴۹۰ nm ،۴۶۵ nm ،۴۴۰ nm ،۴۱۵ مقیادیر فیاکتور کیفیت محاسبه شده به ترتیب ۳۵۰۰، ۲۲۱۰، ۲۲۱۰، ۱۰۱۰ بدست آمـده اسـت. بـا توجـه بـه شـکل۲، فـاکتور کیفیت با تغییر طول کاواک از ۳۹۰ m تا ۴۱۵ nm افزایش و از ۴۱۵ nm تا ۴۹۰ M کاهش یافته است. همچنین، برای کاواکهایی با طول مختلف با افزایش گامهای ۲۵ nm، جابهجایی غیریکنواخت مد محبوس به سمت طول موجهای کوچکتر بهترتیب ۱۵۵۸/۶، ۱۵۳۲/۴، ۱۵۰۶/۸ نانومتر مشاهده می شود.



شکل ۲: طیف شدت و طول موجهای مدهای شبیه سازی شده برای کاواکهایی با طول ۳۰۰ الی ۴۹۰ نانومتر، با انتخاب بهینه N=۴ ، N_{TO}=۱.

در شکل ۳-الف، طرحواره یک نانوباریکه بلورفوتونی با سه حفره-هوای باریک شده در ناحیه دور از کاواک (۳=۳) و در شکل ۳-ب و ج، الگوی دوبعدی مؤلفه Sx بردار پوئینتینگ مد پایه و مد مرتبه دوم با استفاده از نرمافزار کامسول با روش المان محدود در حوزه فرکانس، نشان داده شده است.

$N_{TO} \leftarrow N \rightarrow$	N _{TI}	(الف)
00000000	0000 0000	00000000
\xrightarrow{X}	➡	
		(ب)
000000000	00000000000	000000000
		(ج)
00000000000	00000000000	0000000000

شکل ۳: الف) طرحواره ساختار یک نانوباریکه بلور فوتونی با N=۵، طول کاواک N_{TI}=۴،۴۴۰ nm و ۳=N_{TO} ؛ الگوی دو بعدی S_x ب) مد پایه ج) مد مرتبه دوم.

همانطور که در شکل دیده میشود، مد پایه دارای قلههای تمرکزی در ناحیه میانی کاواک بوده در حالی که شدت موج برای مد مرتبه دو در این ناحیه میانی کاهش یافته ولی تمرکز آن در ناحیه آینههای طرفین واقع می گردد. در ادامه تحقیق، برای ساختار ۴–NTO و N=۵ ، قطر پنج حفره-هوا در آینه دو طرف کاواک تغییر داده شده و نتایج در شکل ۴ نشان داده شده است. همانطوری که دیده میشود، با افزایش قطر حفرهها تا mTO +۲۸۰ ها، روند کاهشی برای طول موجهای مد پایه مشاهده می شود. در این وضعیت، فاکتور کیفیت به ازای قطرهای تا ۲۰۰

نانومتر، تغییرات نوسانی داشته و بعد از آن افزایش و تثبیت یافته و در d=۲۸۰ nm مقدار آن دوباره کاهش مییابد. بیشترین مقدار فاکتور کیفیت حدود ۲۰۵۵۰ در طول موج ۱۴۵۹.۱ nm و کمترین مقدار آن ۱۸۵۰ در طول موج ۱۴۷۴ اتفاق میافتد.



شکل ۴: تغییرات طول موج و فاکتور کیفیت مد پایه برحسب تغییرات قطر حفره-هوا در آینه با تعداد N=۵.

در شکل ۵، نمودار وابستگی افزایشی طول موج مد پایه برحسب تغییرات ثابت شبکه حفرهها در آینههای طرفین را نشان میدهد. افزایش طول موج تا ثابت شبکه ۳۵۰ nm ادامه یافته و فقط در مرحله پایانی کاهش مییابد، که دلیل آن را میتوان به تغییر مرتبه مد نسبت داد. همان گونه که مشاهده میشود، فاکتور کیفیت مد پایه در ناحیه ۳۱۰ – ۳۲۰ه، دارای مقادیر افزایش یافته ای با مقدار بیشینه تقریبا ۲۰۴۳۰ در طول موج ۱۴۶۵/۵۵، به ازای ۳۱۵ ۳۱۵ هیباشد.



شکل ۵: تغییرات طول موج تشدید و فاکتور کیفیت مد پایه بر حسب تغییرات ثابت شبکه حفرهها در آینههای طرفین با ۴=N_{TO} و ۵=N.

برای مد دوم هم همانطوری که در شکل ۶ نشان داده شده، با افزایش قطر حفرهها در آینهها، طولموج مدها کاهش مییابد، ولی فاکتور کیفیت روند افزایشی را تا میزان حدود ده برابر، طی میکند.



در شکل ۷، مقدار فاکتور کیفیت برحسب تعداد حفره-هوای دورهای مندرج در آینهها برای یک، دو، سه یا چهار حفره باریکشده در ناحیه دور از کاواک نمایانده شده است. برای ۱و۴ = N_{TO} ، با افزایش تعداد حفره-هوای آینهها از ۵ به ۸، روند بهینهسازی مقدار فاکتور کیفیت با افزایش قابل ملاحظه تا حدود ۱۰ برابر دیده میشود، و این در حالی است که برای ۲و۳ = N_{TO} مقدار فاکتور این در حالی است که برای ۲و۳ = مقدار اشارهای آغاز کیفیت اگرچه با مقادیر زیادتر و قابل اشارهای آغاز گردیده، ولی دارای افتوخیز و حتی کاهش نیز است.





۳-نتیجهگیری

در این مقاله، افزایش مقادیر فاکتور کیفیت نانوکاواکهای متشکله در ساختار نانوباریکه بلور فوتونی و بهینهسازی آن، مورد بررسی قرار گرفته است. بلورهای فوتونی به تغییر قطرهای حفره-هوا بسیار حساس هستند و با تغییری کوچک در قطر حفرهها، فاکتور کیفیت به میزان زیادی تغییر مییابد؛ بنابراین بهینهسازی آن از اهمیت

زیادی برخوردار است. فاکتور کیفیت ماکزیمم ساختار مورد بررسی قبل از بهینهسازی، دارای مقداری در حدود ۳۵۰۰ بوده و هنگامی که ثابت شبکه و شعاع حفرههای مجاور کاواک نانوباریکه و طول کاواک تغییر داده شد، باعث کاهش اتلاف شده و در نتیجه فاکتور کیفیت به مقدار بسیار قابل اشارهای در حدود ۲۰۵۵۰ افزایش یافت. تغییر تعداد سری حفره-هوای باریکشونده انتهایی از 1=*N*_{TO} به دو، سه، و چهار و همچنین افزایش تعداد حفرهها در آینهها، منجر به مزید کاهش پراکندگی شده و اگرچه بهطور ضمنی و جزئی حجم مدی واقعی کاواک را کمی میافزاید، نهایتاً باعث افزایش قابل ملاحظه فاکتور کیفیت گردیده است.

مراجع

- J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, R. D. Meade, *Photonic Crystals - Molding the Flow of Light*, Princeton University Press, 2nd Ed. (2008).
- [2] R. Ohta et al., Strong coupling between a photonic crystal nanobeam cavity and a single quantum dot, Appl. Phys. lett., 98, 173104 (2011).
- [3] Y. Gong et al., Nanobeam photonic crystal cavity quantum dot laser, Optics Express, 18, No.9, 8781-8789 (2010).
- [4] B-H. Ahn, J-H. Kang, M-K. Kim, j-h. Song, B. Min, K-S. Kim, and Y-H. Lee., One dimensional parabolic-beam photonic crystal laser, Optics Express, 18, No. 6, 5654-5660 (2010).
- [5] M. Lončar et al., High Quality Factor Photonic Crystal Nanobeam Cavities and Their Applications, Conference IPNRA, Integrated Photonics and Nanophotonics Research and Applications (2009).
- [6] P. B. Deatare, M. W. McCutcheon, I. W. Frank, M. Khan et al., *Coupled photonic crystal nanobeam cavities*, Appl. Phys. Lett., 95, 031102 (2009).
- [7] S. Meesala, Photonic crystal nanobeam cavities physics, fabrication, experiments and applications, Harvard School of Engineering and Applied Sciences (2011).
- [8] C. Schriever, C. Bohely, J. Schilling, Numerical investigation of taper parameters for high Q infiltrated nanobeam slot microcavities, Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 10, 312-318 (2012).
- [9] P. Velha, E. Picard, T. Charvolin, E. Hadji, J. C. Rodier, P. Lalanne, D. Peyrade, *Ultra-High Q/V Fabry- Pérot microcavity on SOI substrate*, Optics Express, 15, No. 24,16090-16096 (2007).